

INTERNATIONAL
STANDARD

ISO
4287

NORME
INTERNATIONALE

First edition
Première édition
1997-04-01

**Geometrical Product Specifications
(GPS) — Surface texture: Profile method —
Terms, definitions and surface texture
parameters**

**Spécification géométrique des produits
(GPS) — État de surface: Méthode
du profil — Termes, définitions et
paramètres d'état de surface**



Reference number
Numéro de référence
ISO 4287:1997(E/F)

Contents

	Page
1 Scope	1
2 Normative references	1
3 Terms and definitions	2
3.1 General terms	2
3.2 Geometrical parameter terms.....	6
4 Surface profile parameter definitions.....	10
4.1 Amplitude parameters (peak and valley).....	10
4.2 Amplitude parameters (average of ordinates)	13
4.3 Spacing parameters	15
4.4 Hybrid parameters	15
4.5 Curves and related parameters.....	16

Annexes

A Text equivalents	19
B Flowchart for surface assessment	20
C Comparison of basic terms and parameter symbols between ISO 4287-1:1984 and ISO 4287:1996	21
D Relationship to the GPS matrix model	23
E Bibliography	25

© ISO 1997

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher. / Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

International Organization for Standardization
Case postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Switzerland

Printed in Switzerland / Imprimé en Suisse

Sommaire

Page

1	Domaine d'application.....	1
2	Références normatives.....	1
3	Termes et définitions	2
3.1	Définitions générales	2
3.2	Définitions géométriques.....	6
4	Définitions des paramètres de profil.....	10
4.1	Paramètres d'amplitude (saillie et creux)	10
4.2	Paramètres d'amplitude (moyenne des ordonnées).....	13
4.3	Paramètres d'espacement.....	15
4.4	Paramètres hybrides	15
4.5	Courbes et paramètres associés	16

Annexes

A	Équivalents textuels	19
B	Diagramme pour l'évaluation de surface	20
C	Comparaison des symboles des termes de base et des paramètres entre l'ISO 4287-1:1984 et l'ISO 4287:1996	21
D	Relation avec la matrice GPS	23
E	Bibliographie	25

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

International Standard ISO 4287 was prepared by Technical Committee ISO/TC 57, *Metrology and properties of surfaces*, and has been based on studies carried out by the *Joint Harmonization Group* of ISO/TC 3, *Limits and fits*, ISO/TC 10, *Technical drawings, product definition and related documentation*, SC 5, *Dimensioning and tolerancing*, and ISO/TC 57, *Metrology and properties of surfaces*.

This first edition of ISO 4287 cancels and replaces ISO 4287-1:1984. This revision of ISO 4287-1:1984; is a major rewrite and reorganization that, together with ISO 11562 and ISO 3274, additionally defines the waviness profile, the primary profile and their parameters in a consistent manner.

Annex A forms an integral part of this International Standard. Annexes B, C, D and E are for information only.

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 4287 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 57, *Métrologie et propriétés des surfaces*, sous-comité SC 1, *Paramètres géométriques — Instruments et procédures pour la mesure de la rugosité et de l'ondulation des surfaces*, et tient compte des études menées par le groupe d'harmonisation joint entre l'ISO/TC 3, *Ajustements*, l'ISO/TC 10, *Dessins techniques, définitions de produits et documentation y relative*, sous-comité SC 5, *Cotation et tolérancement* et l'ISO/TC 57, *Métrologie et propriétés des surfaces*.

Cette première édition de l'ISO 4287 annule et remplace l'ISO 4287-1:1984. Cette révision constitue une réorganisation et une réécriture importantes de l'ISO 4287-1:1984; avec l'ISO 11562 et l'ISO 3274, elle ajoute, de façon cohérente, les définitions du profil d'ondulation, du profil primaire ainsi que de leurs paramètres.

L'annexe A fait partie intégrante de la présente Norme internationale. Les annexes B, C, D et E sont données uniquement à titre d'information.